

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

**ТЕРМИЧЕСКАЯ ИОНИЗАЦИЯ ДЫРОК
ИЗ ДИСЛОКАЦИОННОГО ЦЕНТРА
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ**

Велиев З. А.

1. Согласно эффекту Пула—Френкеля [1, 2], вероятность тепловой ионизации примесного центра в сильных электрических полях экспоненциально возрастает с увеличением поля. Это связано с тем, что при наложении электрического поля \mathcal{E} происходит понижение потенциала ионизации примесного центра вследствие искажения потенциальной ямы примеси.

Теория ионизации носителей из притягивающих примесных центров построена в [3], где методом Питаевского получено выражение для термической ионизации с кулоновского примесного центра в электрическом поле в случае, когда ионизация обусловлена взаимодействием электронов с акустическими фононами. Получено, что наряду с экспоненциальной зависимостью коэффициента термической ионизации $\beta(\mathcal{E})$ от \mathcal{E} , которая возникает вследствие понижения энергии ионизации примеси в поле, появляется зависимость от электрического поля предэкспоненциального множителя, связанная с изменением скорости диффузии электронов по высоковозбужденным состояниям примеси.

Настоящая работа посвящена теории тепловой ионизации с дислокационного центра вследствие взаимодействия дырок с акустическими фононами. Известно, что в электронных полупроводниках краевая дислокация ведет себя как бесконечно протяженная линия акцепторов, несущая на себе отрицательный заряд, который является для дырок притягивающим центром. Поэтому форма расчета авторов работы [3] справедлива и в рассматриваемом случае.

2. Вычисление вероятности термической генерации дырок с изолированного яркочного центра проведем методом каскадного захвата [3, 4], который использовался в [5] для вычисления сечений захвата дырок заряженной дислокацией полупроводнике в электрическом поле.

В стационарных условиях в области высоковозбужденных связанных состояний, для которых справедливо квазиклассическое рассмотрение, функция распределения дырок удовлетворяет уравнению

$$B(E, \mathcal{E}) \left[f + kT \frac{\partial f}{\partial E} \right] = -\beta(\mathcal{E}).$$

При наличии электрического поля \mathcal{E} коэффициент $B(E)$ будет также зависеть от \mathcal{E} и определяться формулой

$$B(E, \mathcal{E}) = \delta_0 \int d\varepsilon \int d^3 r \rho(\varepsilon) v(\varepsilon) \delta[E - \varepsilon - U(|\mathbf{r}|) + e(\mathcal{E}\mathbf{r})],$$

где $\delta_0 = 2mS_0^2/kT$, $\rho(\varepsilon)$ и $v(\varepsilon)$ — плотность энергетических состояний и частота релаксации по импульсу дырок на акустических фононах соответственно [4].

Согласно [3], коэффициент термической ионизации вычисляется по формуле

$$\beta(\mathcal{E}) = \frac{kT}{3} \bullet \frac{E_D}{kT} \int_{-\Delta}^{-\Delta} \frac{\exp(E'/kT)}{B(E', \mathcal{E})} dE',$$

где E_D — энергия связи основного состояния дырок в дислокационной яме Δ — понижение дислокационной ямы под действием электрического поля. Величина Δ в пределах низких ($\alpha \gg 1$; $\alpha = e^2 f_0 / \epsilon_0 a k T$, f_0 — коэффициент заполнения дислокации электронами, a — период решетки вдоль дислокации, ϵ_0 — диэлектрическая проницаемость, T — температура решетки, k — постоянная Больцмана, α — отношение кулоновских энергий электронов, осевших на дислокацию, к их тепловой энергии) и высоких ($\alpha \ll 1$) температур вычислена автором в [5] (см. формулы (3), (4) в [5]). Не увлекаясь деталями расчета, которые делаются аналогично работе [5], для коэффициента термической ионизации имеем

$$\beta = \beta_0 \begin{cases} 1.67 \alpha^3 \exp(-E_D/kT) & \text{при } \Delta \ll kT, \\ 1.47 \alpha^3 \exp[-(E_D - \Delta)/kT] & \text{при } \Delta \gg kT \end{cases}$$

в пределах низких температур ($\alpha \gg 1$);

$$\beta = \beta_0 \begin{cases} 1.26 \alpha^3 \exp\left(-\frac{1}{\alpha}\right) \exp(-E_D/kT) & \text{при } \Delta \ll kT, \\ 2 \alpha^2 \left(\ln \frac{e \mathcal{E} R_0}{U_0} + 1\right) \exp[-(E_D - \Delta)/kT] & \text{при } \Delta \gg kT \end{cases}$$

в пределах высоких температур ($\alpha \ll 1$). Здесь $\beta_0 = 4\sqrt{2} (m^2 E_c r_D)^2 V (kT)^2 \pi^2 \hbar^7 \rho_0 S$, E_c — константа деформационного потенциала, S — площадь поверхности, перпендикулярной оси дислокации, m — масса дырок, ρ_0 — плотность кристалла, r_D — дебаевский радиус дырок, V — объем кристалла.

Из выражений (4), (5) [5] видно, что в сильных электрических полях ($\Delta \gg kT$) помимо экспоненциальной зависимости β и предэкспоненциальный множитель в выражении коэффициента ионизации зависит от поля. Приложении электрического поля сечение захвата σ и β — коэффициент термической ионизации — меняются независимым образом и между ними существует следующая связь, вытекающая из общих определений σ и β :

$$\beta = \sigma \frac{\langle v \rangle}{(\pi \hbar^3)} \left(\frac{\pi m k T}{2}\right)^{3/2} \frac{U\left(\frac{3}{2}, \mu + \frac{5}{2}, \mu\right) \mu^{\mu+3/2}}{\left(\mu - \frac{\Delta}{kT}\right)^\mu} e^{-E_D/kT},$$

где $\langle v \rangle$ — средняя тепловая скорость дырок, $U(x, y, z)$ — гипергеометрическая функция Куммера, $\mu = (\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)^2$ характеризует степень разогрева дырок в электрическом поле, $\mathcal{E}_0 = [(6m s_0 k T)^{1/2} / \pi e \hbar^4 \rho_0 S_0^2] m E_c^2 k T$.

В пределах слабого и сильного электрических полей $[U(3/2, \mu + 5/2, \mu) \rightarrow \left(\mu - \frac{\Delta}{kT}\right)^\mu \text{ при } \mu \ll 1]$, как следует из (6), связь между σ и $\beta(\mathcal{E})$ выглядит следующим образом:

$$\beta = \begin{cases} \frac{1}{2} \langle v \rangle N_c \sigma \exp\left(-\frac{E_D}{kT}\right) & \text{при } \mu = \frac{\mathcal{E}^2}{\mathcal{E}_0^2} \ll 1, \\ \sigma \frac{\langle v \rangle}{2} \left(\frac{T_h}{T}\right)^{3/2} \left(\frac{2}{3}\right)^{3/2} \frac{\Gamma(3/4)}{\sqrt{2}} \exp\left[-\frac{E_D - \Delta}{kT} - \frac{3}{2} \left(\frac{\Delta}{kT_h}\right)^2\right] & \text{при } \mu = \frac{\mathcal{E}^2}{\mathcal{E}_0^2} \gg 1, \end{cases}$$

$N_c = 2 (2\pi m k T / \hbar^2)^{3/2}$, где $kT_h = e \mathcal{E} l_0^{1/2}$ — температура разогретых дырок, $l_0 = \pi \hbar^4 \rho_0 / 2 m^3 E_c^2$ — энергетическая длина релаксации.

Список литературы

- [1] Polle H. // Phil. Mag. 1914. V. 27. P. 58.
- [2] Френкель Я. И. Собрание избранных трудов. М., 1975. 317 с.
- [3] Абакумов В. Н., Яссиевич И. Н., Крещук Л. Н. // ЖЭТФ. 1978. Т. 74. В. 4. С. 1019–1025.
- [4] Абакумов В. Н., Перель В. И., Яссиевич И. Н. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 1. С. 1–32.
- [5] Велиев З. А. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 7. С. 1351–1353.

Научиванский государственный
педагогический институт
им. академика Ю. Г. Мамедалиева

Получено 16.06.1989
Принято к печати 31.07.1989